## Московский Физико-Технический Институт

Факультет Биологической и Медицинской Физики

# Основы MALDI-TOF масс-спектрометрии

Выполнили: Яновская Дарья (6112)

Михайлова Анна (6112)

Колосов Семен (6112)

### 1 Цели работы

- Получение масс-спектра смеси пептидов с и без рефлектрона.
- Определение зависимости основных аналичических характеристик от энергии лазера.
- Определение зависимости основных аналичических характеристик от длительности ускоряющего напряжения.
- Определение зависимости основных аналичических характеристик от длительности импульса.

### 2 Теоретическая часть

#### 2.1 Метод ионизации MALDI

Масс-спектрометр - прибор для химических исследований. Анализируемые молекулы (аналиты) сначала ионизируют в вакууме. Затем вновь образовавшиеся заряженные частицы вводятся в электрическое и (или) магнитное поле, причем их движение в поле зависит от отношения их массы к заряду (m/z). Эта измеряемая величина может быть использована для определения молекулярной массы аналита с высокой точностью.

В данной работе для исследования высокомолекулярных исследований используется метод ионизации MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization) вместе с времяпролётным масс-анализатором (TOF — time of flight). Особенностью данного метода является перевод вещества из конденсированного состояния в газовую фазу под воздействием лазерного излучения, что позволяет провести «мягкую» ионизацию. Наиболее эффективно облучать исследуемое вещество в смеси с другим веществом — матрицей. Матрица адсорбирует (поглощает) энергию излучения лазера, что предотвращает разрушение анализируемых молекул.

Чтобы приготовить образец для массспектрометрического анализа MALDI, нужно растворить аналит и матрицу в подходящем растворителе с последующей сокристаллизации указанных компонентов на металлической подложке (мишени). При переходе в твердую фазу растворитель испаряется и происходит сокристаллизация. При освещении лазером высокая при низком давлении (около 0.75 торр) плотность энергии в точке облучения приводит к взрывному испарению матрицы, которая включает в себя следы анализируемого соединения. В результате над мишенью образуется облако ионов и незаряженных частиц с начальными скоростями от 400 до 800 м/с. Нейтральные частицы удаляются турбомолекулярным насосом, а ионы вытягиваются разницей потенциалов, приложенной между мишенью и фокусирующими линзами.

 ${f Macc\text{-}cnektp}$  — это зависимость интенсивности ионного тока (количества вещества) от отношения массы к заряду.

Процесс ионизации в MALDI состоит из двух стадий:

- 1. Первая стадия (**первичная ионизация**) образование первичных свободных ионов из молекул матрицы(фазовый переход твердое тело газ). **Абляция** процесс взрывного испарения твердого тела при перегревании высоко-интенсивным лазерным излучением.
- 2. Вторая стадия (**вторичная ионизация**)— формирование ионов анализируемого вещества в газовой фазе в результате взаимодействия ионов матрицы и нейтральных молекул анализируемого вещества (ион-молекулярных процессы).

**Десорбция** - плавный переход от твердого тела к газовой фазе вблизи поверхности образца. Происходит обеих стадиях.

#### 2.2 MALDI-TOF масс-спектрометрия

Схема масс-спектрометра состоит из области с высоким значением E напряженности электрического поля и бесполевой области дрейфа. Ускоряющее напряжение  $U=E\cdot s$ . Время t движения иона от момента начала лазерного импульса до момента попадания иона на детектор следующим образом зависит от величины  $\sqrt{m/z}$ :

$$t = \sqrt{m/z} \cdot const + t_0$$

где const и  $t_0$  определяются длиной полевой области, длиной бесполевой области (области дрейфа), расстоянием от места образования иона до поверхности образца, начальной кинетической энергии иона, разностью потенциалов и временем от момента начала лазерного импульса до момента образования ионы.

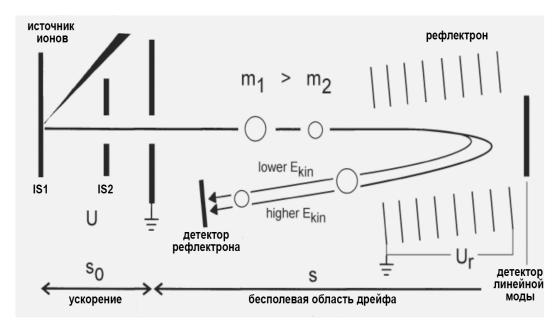


Рисунок 1: MALDI-TOF масс-спектрометр с рефлектроном.

#### 2.2.1 Метод импульсной экстракции ионов РІЕ

В процессе PIE участвуют мишень(IS1) с образцом, пластина вторичного напряжения(IS2) и заземленный ускоряющий электрод.

**На первом этапе** на IS1 и IS2 потенциял  $\phi_1$  и аналит не подвергается воздействию внешних эффектов до удара лазерного луча.

**На втором этапе** в факеле происходит ионизация аналита и тепловой дрейф ионов от IS1 к IS2. Из за теплового разброса у них разная начальная скорость.

**На третьем этапе** после некоторого времени задержки  $t_{delay}$  потенциал IS2 снижается до  $\phi_2$ , создавае поле, которое заставляет все заряженные частицы двигаться к IS2. В результате ионы с заданной массой и различными начальными скоростями достигнут детектора одновременно.

#### Свойства:

- 1. оптимальное время задержки зависит от (m/z) т.е. эффективная фокусировка ионов осуществляется для узкого диапазона (m/z)
- 2. оины с большими массами лучше фокусируются при увеличении амплитуды выталкивающего импульса и  $t_{delay} = const$
- 3. время задержки уменьшается с увеличением амплитуды выталкивающего импульса

#### 2.2.2 Рефлектрон

При помощи электростатического поля ионы отражаются под небольшим углом в направлении детектора рефлектрона. Ионы с большей кинетической энергией проникают глубже внутрь поля рефлектрона, тратя больше времени на замедление и последующее ускорение. Достигая ионного зеркала первыми, они последними покидают его и догоняют более медленные ионы. Свойстава:

- 1. фокусировка ионов не зависит от массы
- 2. нельзя использовать для анализа больших белков

#### 2.2.3 Порог чуствительности и разрешающая способность

**Порог чувствительности** определяется минимальным количеством молекул образца, которое дает детектируемый ионный сигнал в масс-спектре (в диапазоне наномолей для пептидов и в диапазоне микромолей для белков).

**Разрешающая способность** определяется как  $R = \frac{x}{\Delta x}$ , где  $\Delta x$  — расстояние между максимально близко стоящими пиками, но тем не менее различными, а x — характерная величина координаты этих пиков.

#### 2.3 Изотопное распределение

Разные атомы одного элемента могут иметь разную массу из-за разного количества нейтронов в ядре - изотопы.

**Изотопные пики** - пики, сооьветствующие ионам с одной химической формулой, но разным изотопным составом. Если разрешение прибора высокое, можно увидеть тонкую изотопную структуру, где каждому изотопу соответствует свой пик. Иначе, пики сливаются в один. При заряде иона 1 расстояние между изотопными пиками m/z=1, при заряде 2-m/z=0.5 и тд.

Моноизотопные пики - все атомы, входящие в состав, одной массы.

## 3 Экспериментальная часть

## 3.1 Определение зависимости аналитических характеристик метода от мощности лазерного излучения при Default linear

Сняли спектры смеси пептидов при значениях мощности лазера от 0 до 100 с шагом 10. Ниже 20 вообще не видели никакого масс-спектра. От 20 до 40 виден только шум. Выше 40 стали различимы пики.

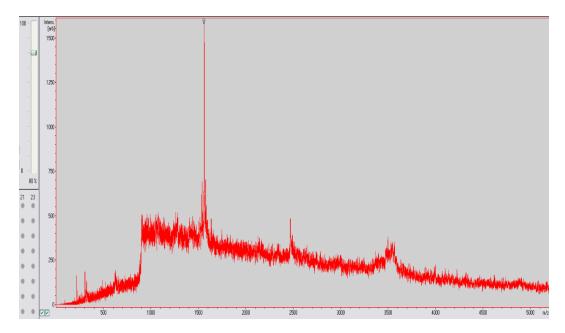


Рисунок 2: Спектр при мощности лазера 80, на которой лучше всего видны пики.

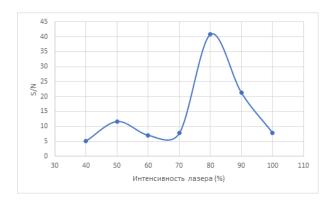


Рисунок 3: Зависимость значений S/N от мощности лазерного излучения для пика 1557 Да.

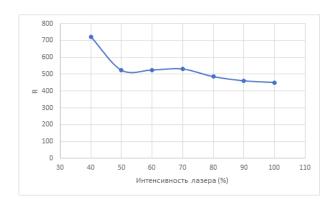


Рисунок 4: Зависимость разрешения пиков от мощности лазерного излучения для пика 1557 Да.

# 3.2 Определение зависимости аналитических характеристик метода от мощности лазерного излучения при Default reflectron

Сняли спектры смеси пептидов при различных значениях мощности лазера на методе с рефлектроном. Пики различимы с 60. Наилучшее соотношение сигнал/шум при мощности 80. Также наблюдается уменьшение разрешения пиков при увеличении мощности лазера. Это можно объяснить тем, что происходит фрагментация молекул, а также присутствует больший тепловой разброс по скоростям.

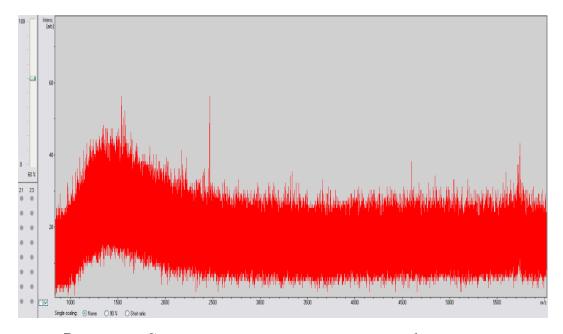


Рисунок 5: Спектр при мощности лазера 60 с рефлектроном.

# 3.3 Определение влияния времени включения ускоряющего потенциала на масс-спектр в режиме без рефлектрона

Снимем спектры смеси пептидов при различных значениях времени включения ускоряющего потенциала (от 0 нс до 500 нс) и построим графики зависимости значений S/N (отношение сигнал/шум) и разрешения основных пиков от времени включения ускоряющего потенциала.

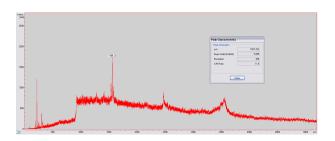


Рисунок 6: Спектр при t=0 нс.

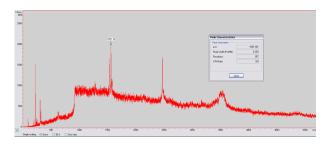


Рисунок 7: Спектр при t=40 нс.

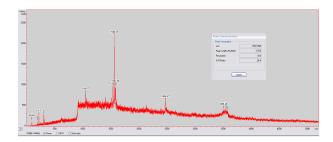


Рисунок 8: Спектр при t=80 нс.

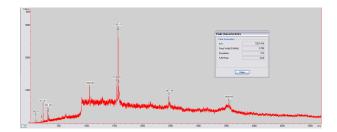


Рисунок 9: Спектр при t=120 нс.

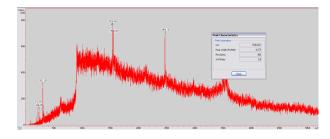


Рисунок 10: Спектр при t=180 нс.

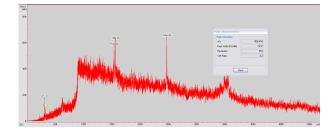


Рисунок 11: Спектр при t=250 нс.

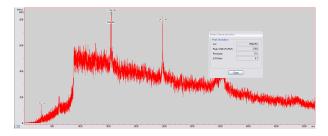


Рисунок 12: Спектр при t=330 нс.

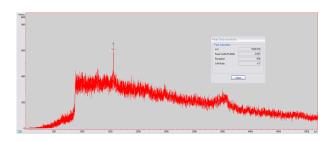


Рисунок 13: Спектр при t=410 нс.

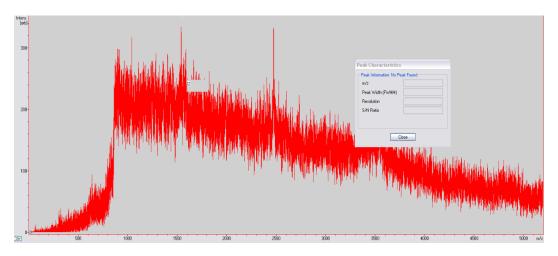


Рисунок 14: Спектр при t=500 нс.

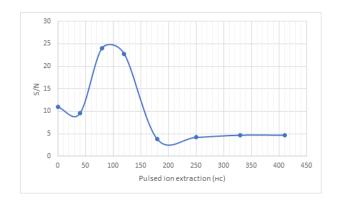


Рисунок 15: Зависимость значений S/N от времени включения ускоряющего потенциала без рефлектрона.

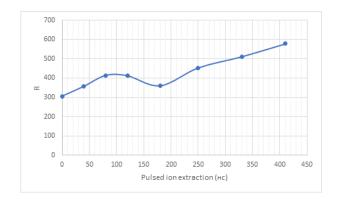


Рисунок 16: Зависимость разрешения пиков от времени включения ускоряющего потенциала без рефлектрона.

Исходя из графика, можно предположить, что при увеличении времени включения ускоряющего потенциала всё больше частиц успевает откачаться насосами, в том числе и источники шума. Количество ионов аналита, имеющих достаточную энергию для вылета в дрейфовую зону, падает сильно, что и приводит к уменьшению значения S/N.

# 3.4 Определение влияния времени включения ускоряющего потенциала на масс-спектр в режиме с рефлектроном

Снимали спектры смеси пептидов при значениях времени включения ускоряющего потенциала от 0 нс до 250 нс. При увеличении времени пики пропадают и остается только шум.

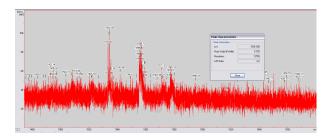


Рисунок 17: Спектр при t=0 нс.

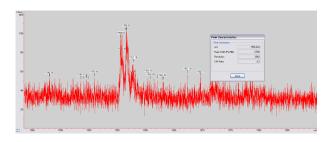


Рисунок 18: Спектр при t=40 нс.

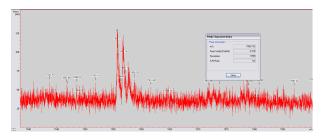


Рисунок 19: Спектр при t=80 нс.

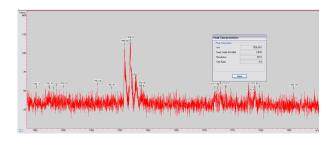


Рисунок 20: Спектр при t=120 нс.

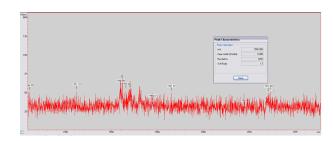


Рисунок 21: Спектр при t=180 нс.

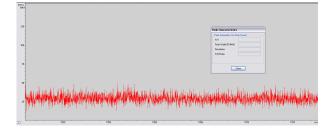


Рисунок 22: Спектр при t=250 нс.

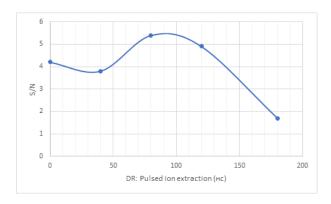


Рисунок 23: Зависимость значений S/N от времени включения ускоряющего потенциала с рефлектроном.

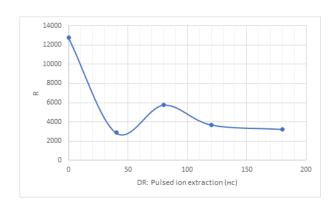


Рисунок 24: Зависимость разрешения пиков от времени включения ускоряющего потенциала с рефлектроном.

#### 3.5 Определение влияния подавления матрицы на масс-спектр

Рассмотрели, как влияет параметр Deflection на масс-спектр. Сняли спектры при различных значения этого параметра от 0 до 1200 Да с шагом 200 Да.

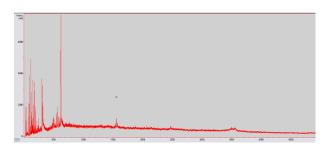


Рисунок 25: Спектр для 0 Да.

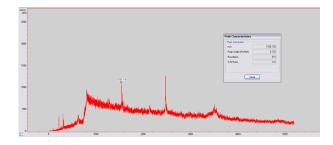


Рисунок 26: Спектр для 800 Да.

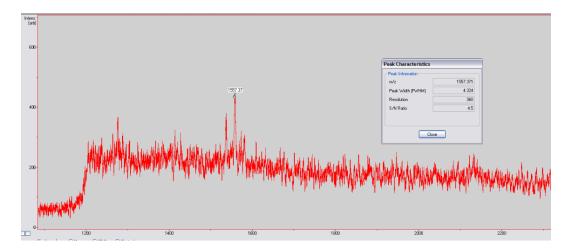


Рисунок 27: Спектр для 1200 Да.

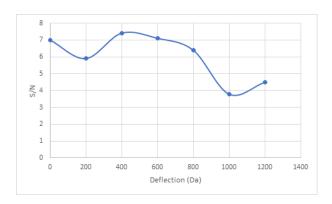


Рисунок 28: Зависимость значений S/N от параметра Deflection.

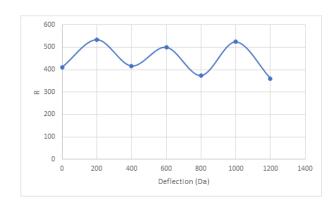


Рисунок 29: Зависимость разрешения пиков от от параметра Deflection.

### 4 Вывод

Исходя из полученных данных, порог появления спектра соответствовал значению интенсивности излучения лазера 40 процентов в режиме измерений без рефлектрона. При использовании рефлектрона это значение повышается до 60 процентов, так как в таком режиме меньше ионов долетает до детектора.

Время задержки РІЕ не влияет на расплыв пика в некотором диапазоне. Однако при РІЕ больше 600 нс большая часть молекул откачивается форвакуумным насосом, что влияет на характеристики масс-спектра.

Полученных данных не достаточно для установления зависимости параметров масс-спектра от режима проведения измерений. Для установления зависимостей нужно произвести многократное повторение каждого измерения, чтобы говорить о статистической значимости выводов. Разброс значений, имеющихся на данный момент, можно объяснить как нелинейной зависимостью параметров спектра от режима эксперимента, так и неоднородностью распределения матрицы по поверхности пластины. Наличие фона на полученных масс-спектрах объясняется присутствием в смеси молекул матрицы, а также фрагментов аналита (даже при выключенном режиме фрагментации).

## 5 Список литературы

1. Основы MALDI ТОF масс-спектрометрии: учеб.- метод. пособие сост.: А.С. Воробьев, Е.С. Жванский, С.И. Пеков, К.В. Бочаров, Д.А. Зубцов, И.А. Попов. - М.: МФТИ, 2018. - 38 с.